

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 10.09.2013 faxen an
(030) 63 92-65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Vortrag ja nein Poster ja nein

Titel des Vortrages/Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

125,00 € bei Überweisung bis zum 30.09.2013

180,00 € bei späterer Überweisung, Studenten 20,00 €

Überweisung an: IAP e.V.

Konto-Nr. 102 000 5920, Deutsche Kreditbank AG Berlin, BLZ 120 300 00

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 80,00 €/m² bei Überweisung bis zum 30.09.2013

125,00 €/m² bei späterer Überweisung

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 64,00 € für ein EZ bzw. 76,00 € für ein DZ

zzgl. 12,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Es ist ein begrenztes Zimmerkontingent zu den genannten Preisen verfügbar. Nach Ausschöpfung des Kontingents werden nach Rücksprache ggf. teurere Zimmer gebucht. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

IAP Institut für angewandte
Photonik e.V., Berlin
IfG – Institute for Scientific
Instruments GmbH, Berlin
Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin
Bruker Nano GmbH, Berlin
Helmut-Fischer-Stiftung, Stuttgart
Optec Berlin-Brandenburg e.V.
Physikalisch-Technische Bundes-
anstalt, Braunschweig und Berlin
Arbeitskreis Prozessanalytik
SPECTRO Analytical Instruments
GmbH, Kleve
Technische Universität Berlin
TSB – Technologiestiftung, Berlin
VDI/VDE – Gesellschaft Mess-
und Automatisierungstechnik (GMA)
VDI-Bezirksgruppe Adlershof
WISTA-MANAGEMENT GMBH

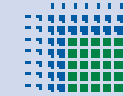
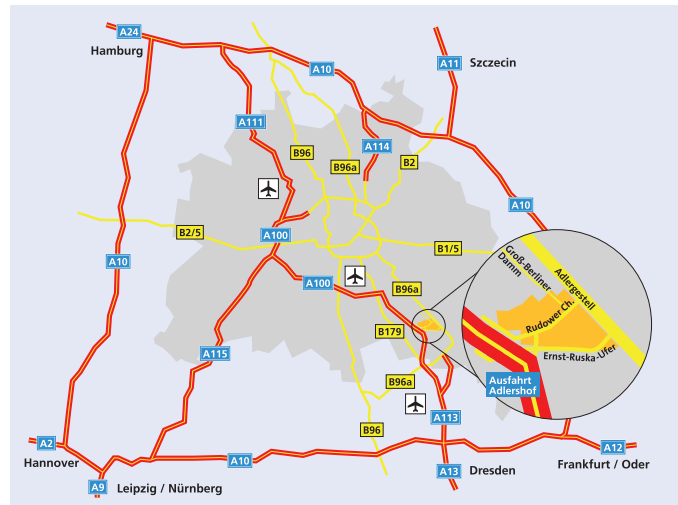
Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92-65 09
Frau D. Zimani (Sekretariat IAP e.V.
und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92-65 00
IAP Institut für angewandte
Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31, 12489 Berlin
Fax: (030) 63 92-65 01
E-Mail: info@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
G. Bruno, BAM, Berlin und Universität
Potsdam
F. Burgäzy, Bruker AXS GmbH, Karlsruhe
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG,
Duisburg
B. Kanngießer, TU Berlin
A. Kharchenko, PANalytical,
Almelo, Niederlande
M. Krumrey, PTB, Berlin
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin
M. Maiwald, BAM, Berlin
H. Miersch, Spectro Analytical
Instruments GmbH, Kleve
M. Ostermann, BAM, Berlin
U. Panne, BAM und HU Berlin
P. U. Pennartz, Rigaku Innovative
Technologies
V. Rößiger, Helmut Fischer GmbH
Institut für Elektronik und Mess-
technik, Sindelfingen
Th. Schüle, Bruker Nano GmbH, Berlin
H. Stiel, MBI, Berlin
R. Wedell, IAP e.V., Berlin
U. Waldschläger, Bruker Nano GmbH,
Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH,
Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter
www.adlershof.de



PRORA 2013

Tagungsankündigung

Fachtagung

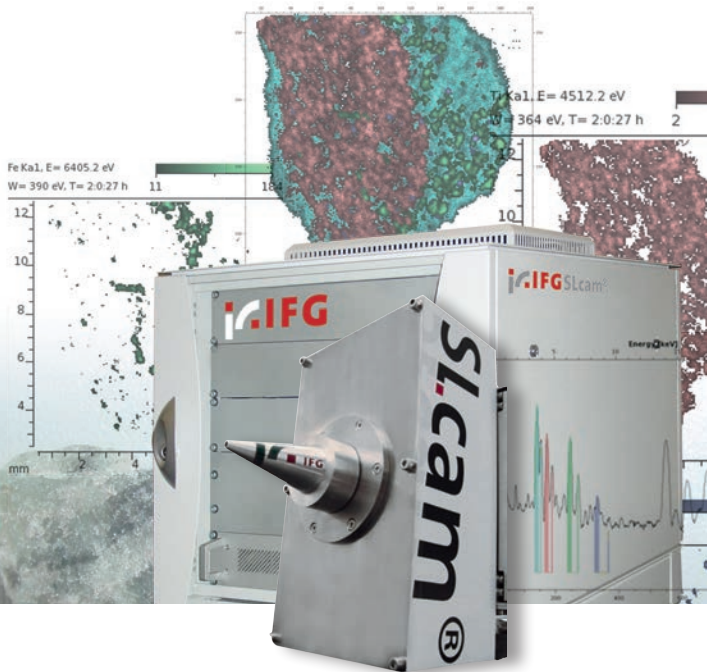
Prozessnahe Röntgenanalytik

21. und 22. November 2013

im WISTA – Wissenschafts-
und Technologiepark Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
Bunsensaal
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



Die renommierte und bundesweit beachtete Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik **PRORA** findet nunmehr zum siebten Mal im Wissenschafts- und Technologiepark Berlin Adlershof statt. Es sind alle Anwender, Entwickler und Hersteller aus dem Bereich der prozessnahen Röntgenanalytik, sowie alle Interessierten eingeladen und aufgerufen, sich am **21. und 22. November 2013** an der Fachtagung und Fachaustellung **PRORA** zu beteiligen.



Der thematische Mittelpunkt der diesjährigen **PRORA** ist die Anwendung der Röntgenanalytik zur Überwachung von Rohstoff- und Sekundärrohstoffströmen. Daneben sollen natürlich auch Neu- und Weiterentwicklungen sowie interessante Industrieanwendungen der Röntgenanalytik thematisiert werden.

Die Verknappung und die Abhängigkeit von Rohstoffen und Energie werden immer deutlicher. Durch begrenzte Ressourcen und den stetig wachsenden Bedarf sind die Weltmarktpreise explosionsartig gestiegen. Ein besonders hervorstechendes Beispiel ist der Engpass in der Versorgung mit Seltenen Erdmetallen, wodurch sich in den An-

wendungen der Hochtechnologien bereits bedrohliche Engpässe ergeben. In der Folge kommt es zunehmend zu einem Aufleben der Lagerstätten erkundung und -erschließung und einem verstärkten Bestreben Wertstoffe zu recyceln. Die wirtschaftliche und ökologische Gewinnung von Rohstoffen und der effektive Betrieb von Recyclingverfahren erfordern eine solide und robuste prozessnahe Analytik. Gerade hier kann die Röntgenanalytik wichtige Beiträge leisten, steht aber auch vor Herausforderungen wie der Erfassung leichter Elemente und der Bestimmung von Spurenelementgehalten in komplexen und variablen Matrices.

Die Notwendigkeit schneller, kostengünstiger und zuverlässiger Untersuchungsmethoden zeigt sich auch in immer wiederkehrenden Presseberichten zu minderwertigen oder kontaminierten Produkten, denn die Sicherheit der Bevölkerung und der Verbraucher- und Umweltschutz muss an erster Stelle stehen.

Ein weiteres Thema der diesjährigen **PRORA** ist die Kopplung röntgenanalytischer Verfahren mit ähnlichen oder orthogonalen Methoden. Beispiele sind Kopplungen mit Laser- oder Raman-spektroskopie, die es im Zusammenspiel der Methoden erlauben, über die Möglichkeiten der Röntgenanalytik hinaus, eine umfassendere und komplexere Informationstiefe zu erlangen. Derartige Kopplungen werden in den kommenden Jahren stark an Bedeutung gewinnen, und sollen deshalb auch bei der **PRORA** vorgestellt und diskutiert werden.

Tagungsbeiträge / Anmeldung

Es wird darum gebeten, Vorträge sowie Poster bis zum **10. September 2013** einzureichen, bzw. sich als Teilnehmer und / oder Aussteller anzumelden. Selbstverständlich sind auch insbesondere Studenten als Teilnehmer herzlich willkommen.

Rahmenveranstaltung

Besonders hingewiesen wird auf das Satellite – Meeting des Berlin Laboratory of Innovative X-Ray Technology an der TU Berlin am 20.11.2013.



Themenfelder

Methodische Probleme

- Vergleich und Kopplung optischer und röntgenanalytischer Verfahren zur Prozesskontrolle
- Neue methodische Ansätze beim Einsatz der RFA zur Prozesskontrolle
- Softwareanforderungen bei Kombination von Messverfahren (Echtzeitauswertung großer Datenmengen)
- Herausforderungen der Vor-Ort-Analyse an Messgeräte und Peripherie
- Besonderheiten beim Einsatz von Handgeräten

Applikationen in der Industrie

- Prozessanalytik im Bereich Bergbau, Recycling
- Beispiele aus Maschinenbau, Elektronik-, Automobilindustrie, chemischer Industrie
- Kombination röntgenanalytischer und optischer Messverfahren im industriellen Einsatz
- Schutz- und Kontrollmöglichkeiten für die Umwelt durch röntgenanalytische Verfahren

Neue röntgenanalytische Methoden

- Röntgenmikroanalyse (WD) leichter Elemente
- Tiefengradientbestimmung dünner Schichten
- Zeitaufgelöste Röntgenmessverfahren
- Röntgenrefraktometrie
- Röntgenmikroskopie mit Laborgeräten

Neue Entwicklungen bei Komponenten für prozessanalytische Geräte

- Kombinierte röntgen- und lichteoptische Bauelemente
- Weiterentwicklung der Kapillaroptiken
- Fresnel- und Gitteroptiken für den niederenergetischen Röntgenbereich
- Intensive Laborröntgenquellen für den Prozesseinsatz
- Hochbrillante Jet-Röntgenquellen für den Laboreinsatz
- Neuentwicklungen bei den Detektionssystemen für den prozessnahen Einsatz